

早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム

出張講演 実施報告

1. 企業名 : 法人会員 A
2. 講演会場 :
3. 講演者 : 谷井 孝至 (早稲田大学理工学術院 教授)
4. 日 時 : 2017年5月30日(火) 14:30~16:00
5. 講演テーマ : 『ダイヤモンド中単一NV センターを活用した核スピン計測』
6. 出席者 : 103名(中継会場含む)
7. 対象者 : 医用システム及び分析システムの設計・品質保証部門

8. 企業側からの感想

(1) 今回の講演会のご意見・ご感想をお聞かせください。

本講演の内容は現在の当社の製品技術に対して少し距離があるため、製品設計者担当者からは、「内容がやや難しく感じられた」という意見がありました。

一方で、1分子計測や非標識でのたんぱく質の計測など、将来的に当社にとってインパクトの大きな内容も紹介されており、本社の新事業開拓をミッションとする部門から資料閲覧希望の反響もありました。

(2) 今回の講演会は、貴社としてのメリットはございましたか。もしメリットがございましたら差支えない範囲でご記入ください。

センシングの新しい技術や方向性をご紹介いただき、次世代の製品開発・新事業を開拓する技術者に対しては視野を広げる良い機会となったと思います。

なお、交流会・懇親会では微細加工方法で困っている設計者にアドバイスをいただき、ありがとうございました。

(3) その他、ナノテクフォーラム事務局の運営方法や今後の取組みなど、要望事項などありましたらご記入ください。

新技術を開発するに当たって、アプローチの仕方やマネジメント方法などは、大学も企業も共通の課題ではないかと思えます。

このようなテーマで情報交流の場があると面白い活動になるのではないかと思います。

以 上